

开关复位型前放芯片 CPRE_SW2 的噪声及抗辐射性能测试

Tuesday, 16 October 2018 08:45 (15 minutes)

本文介绍了一种匹配冷却型半导体探测器的开关复位型前放芯片 CPRE_SW2，探索其三种不同的复位工作模式，实现对探测器信号的预处理，具有高能量分辨率低噪声的优点。文中给出了芯片的电子学测试过程及与实际探测器联调结果，并针对单粒子锁定效应对芯片进行了辐照试验。

Primary authors: Mr WANG, Ke (Institute of high energy physics, CAS); Ms LI XIAN, Xian (高能所); Mr CAO, Xuelei (Institute of High Energy Physics, CAS); Ms 暴, 子瑜 (中国科学院高能物理研究所)

Presenter: Ms 暴, 子瑜 (中国科学院高能物理研究所)

Session Classification: 第二分会场 (1)

Track Classification: 微电子学及其应用的研究成果